

スペックル評価装置

Van Cittert-Zernike定理に基づくスペックル測定スタンダード

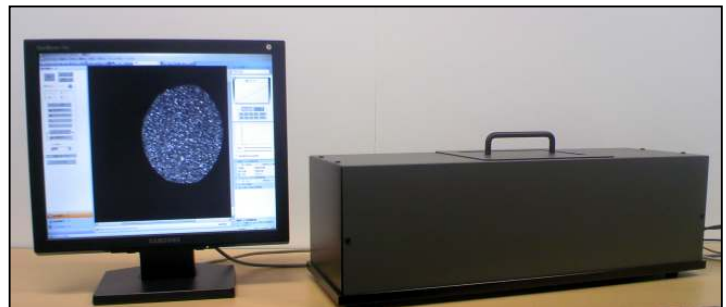
レーザディスプレイ開発に
必須の標準測定器

世界初

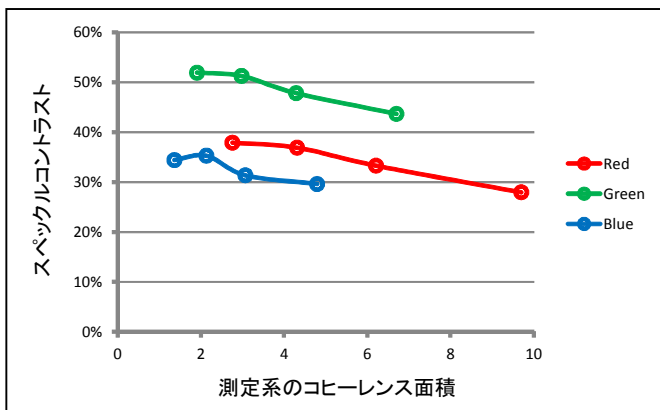
久保田教授 開発
(東京大学生産技術研究所)

特長

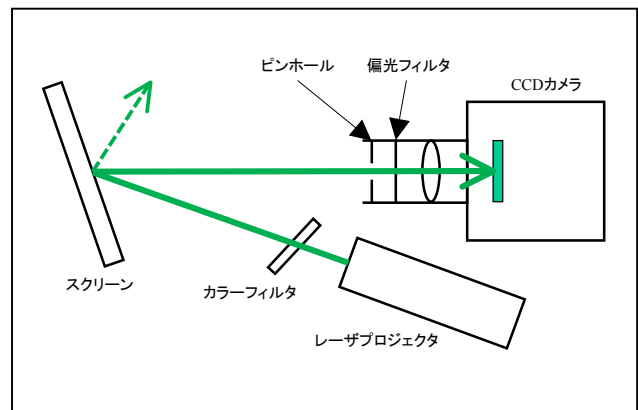
- ✓ 開口数の自由選択
- ✓ 高い再現性
- ✓ 高コントラスト測定



製品外観



測定例



光学系

仕様 (暫定値)	
プロジェクタ出力	> 10 lm
測定スクリーン径	25 mm φ
ピンホール径	0.8/1.0/1.2/1.5 mm
2次元領域内コントラスト定義	$C = \sigma / \bar{I}$
標準対応方式	フロントプロジェクター (リアプロジェクターについては検討中)
測定画像	静止画三原色

価格・納期等の詳細はお問合せください

OXIDE

株式会社 オキサイド

(共同研究パートナー)

〒408-0302 山梨県北杜市武川町牧原1747-1

(Tel) 0551-26-0022 (E-mail) Sales@opt-oxide.com

(Web) <http://www.opt-oxide.com>

(本リーフレットの内容は2011年4月時点の内容です。)